



Panchip Microelectronics Co., Ltd.

PAN7050 添加烧录测试

当前版本: 1.0

发布日期: 2024.11

上海磐启微电子有限公司

地址: 上海张江高科技园区盛夏路 666 号 D 栋 3 楼

联系电话: 021-50802371

网址: <http://www.panchip.com>

文档说明

由于版本升级或存在其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档内容仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

商标

磐启是磐启微电子有限公司的商标。本文档中提及的其他名称是其各自所有者的商标/注册商标。

免责声明

本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，磐启微电子有限公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

修订历史

版本	修订时间	描述
V1.0	2024.11	初始版本创建

目录

1	概述	3
1.1	新增烧录前测试内部 RF 功能.....	3
1.2	软件调整	3
1.3	烧录硬件要求	4
1.4	测试情况	4

1 概述

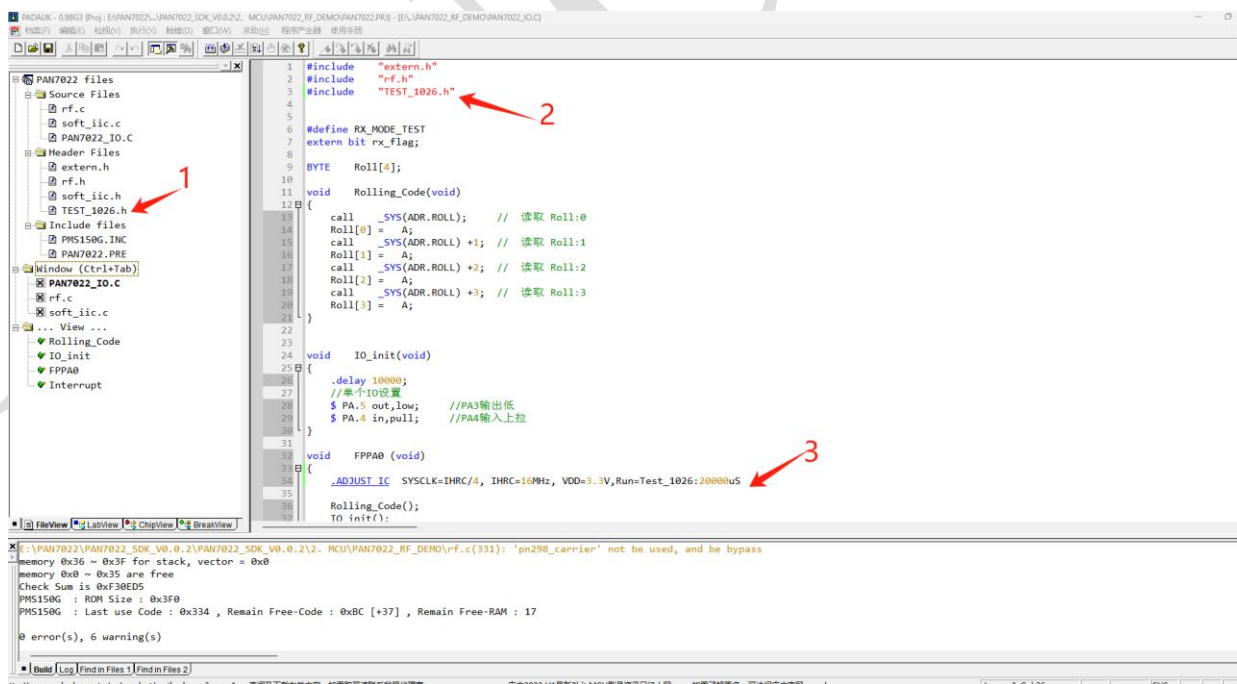
1.1 新增烧录前测试内部 RF 功能

近期出现较多烧录后芯片射频没功能情况，新增在烧录之前做内部射频通讯测试程序。

1.2 软件调整

- 1、声明文件中，添加 TEST_1026.h 文件；
- 2、添加声明，#include “TEST_1026.h”；
- 3、ADJUST 添加 TEST_1026 测试；

具体参考 PAN7050_TRX 写法：



1.3 烧录硬件要求

添加 VDD2 供电:

可以直接从 VDD1 上取电, 通过 LDO 转换到 3.3V 给到 VDD2;

VDD1 电平 7.8V, 取电到 VDD2 上一定要电平转换, 否则会烧坏射频。

1.4 测试情况

芯片内部出问题, MCU 和 RF 通讯异常, 烧录器烧录报错:



芯片正常, 内部通讯正常:

